

超高速・高精度の3D画像検査装置「3D-Eye 35000シリーズ」と フィルム検査装置「Film-Eye 350シリーズ」を同時発売。

日本エフ・エーシステム株式会社（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：小國勇）は、2011年1月11日、3D画像検査装置「3D-Eye35000シリーズ」とフィルム検査装置「Film-Eye 350シリーズ」を発売します。

3D画像検査装置「3D-Eye 35000シリーズ」は、3Dカメラとレーザ光源により、対象物の表面形状を超高速・高精度に計測・検査し、外観不良を検出するシステムです。レーザによる線光源が検査ワークの輪郭形状を高さデータとして取り込むことで、外観色調の影響を受けずに表面の欠陥を定量化した数値で判定し、高精度かつ安定した外観検査が可能となります。3Dカメラにはオンチップ高速演算処理回路を内蔵することで最大35,000プロファイル/秒の超高速処理が可能です。

検査用途としては、BGA (Ball grid array) やチップ部品の高さ、基板の反り、ボンディング量など電子部品の検査・計測用途、食品パッケージや錠剤の形状など食品・医薬品の外観検査用途、素材の外観検査用途などがあげられます。

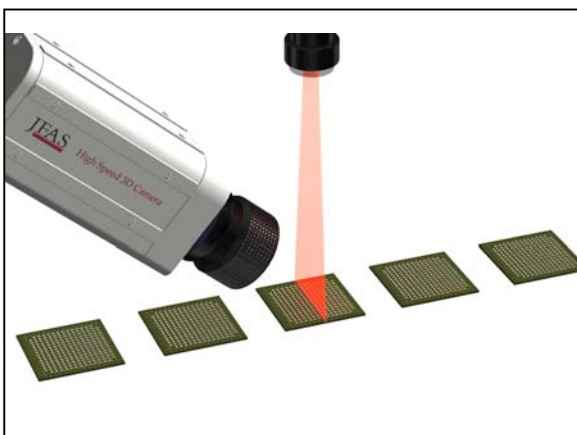
フィルム検査装置「Film-Eye350シリーズ」は、独自の光学・照明技術によりフィルム送り速度350m/分の高速ラインにおいてΦ0.1mmの異物を検出可能な透明・無地フィルム欠陥検査装置です。均一な照明条件を実現することで欠陥検出の精度を向上するとともに、ラインセンサカメラを使用することにより濃淡ムラの無い均一な画像を取得します。また専用ソフトウェアによりPC上解析・分析・履歴を一元管理できます。

検査用途としては、食品・医薬品関連の一般フィルム、FPDやリチウムイオン電池関連の高付加価値フィルム、光学フィルムにおけるピンホールやコート抜けなどの穴欠陥、異物、キズなどの凹凸欠陥、うねり・たわみなどの欠陥検知に対応しています。

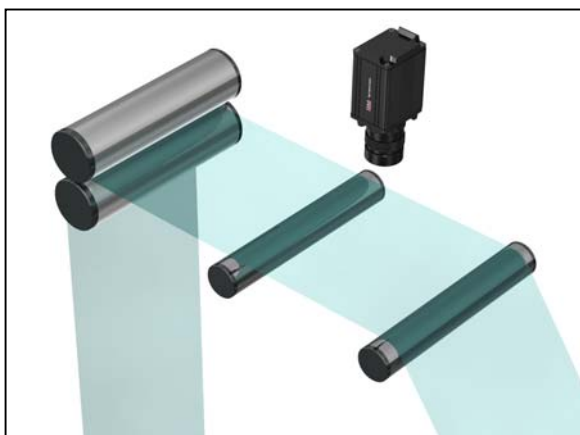
両検査装置は、カスタム設計によりお客様の検査用途に合わせて最適なシステム構築を行います。今後も日本エフ・エーシステムは産業用画像検査装置のシステムインテグレータとして、高速・高精細の画像処理技術を幅広くご提供していきます。

■ 検査イメージ

3D画像検査装置「3D-Eye35000シリーズ」



フィルム検査装置「Film-Eye350シリーズ」



■国内販売数目標（2011年）

各10システム

■主要販売先

半導体業界、電子部品業界、食品業界、医薬品業界、素材業界など

■会社概要

日本エフ・エーシステム株式会社（2010年12月現在）

商号 : 日本エフ・エーシステム株式会社
所在地 : 横浜市港北区新横浜3丁目23番3号 新横浜AKビル
設立 : 1991年6月12日
代表取締役 : 小國 勇
資本金 : 80,000千円
事業内容 : 産業用画像機器の開発、設計、製造、輸出入、販売及びコンサルタント業務
従業員数 : 14名
親会社 : オプテックス・エフエー株式会社（100%出資）

【本件に関するお問合せ先】

日本エフ・エーシステム株式会社

技術営業部 茂木 和哉（E-mail: sales@jfas.co.jp）

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3丁目23番3号 新横浜AKビル

TEL: 045-476-0880 FAX: 045-476-0885

URL: <http://www.jfas.co.jp/>

オプテックス・エフエー株式会社 【JASDAQ: 6661】

営業企画室 石谷 高宏（E-mail: fa@optex-fa.com）

〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク9号館4F

TEL: 075-325-2920 FAX: 075-325-2921

URL: <http://www.optex-fa.jp>